INFORMATION
SCIENCE
TECHNICAL
REPORT

NAIST-IS-TR2006003
ISSN 0919-9527

A New Class of Sequential Circuits with Acyclic Test Generation Complexity

Chia Yee Ooi and Hideo Fujiwara

May 2006

NAIST

〒630-0192
奈良県生駒市高山町 8916-5
奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科

Graduate School of Information Science
Nara Institute of Science and Technology
8916-5 Takayama, Ikoma, Nara 630-0192, Japan